题目：基于CUDA的数码印花缺陷检测算法研发与优化

1. 绪论
2. 相关技术概述
3. 系统整体框架

3.1 硬件

3.2 软件

3.3 本章小结

1. 缺陷检测算法研发

预处理（噪声，光照强度分布不均）

配准与匹配（特征点， opencv第六种）

检测（找一个高大上的算法）分缺陷类型

1. 基于CUDA的检测算法优化
2. 算法测试与结果分析
3. 总结与展望
   1. 总结
   2. 展望